

На описанном криостате нами проведено исследование влияния одноосного сжатия на край оптического поглощения теллура на инфракрасном спектрофотометре UR-20 при $T = 78^\circ \text{ К}$. На рис. 2 приведены спектры поглощения теллура при давлениях $p = 0, 900$ и 1200 кг/см^2 . Свет поляризован параллельно кристаллографической C -оси теллура, направление сжатия параллельно C -оси.

Криостат может быть также использован при измерениях на спектрофотометре ИКС-21.

Авторы выражают благодарность Б. И. Болтаксу за внимание и интерес к работе, И. И. Фарбштейну за предоставление кристаллов теллура.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. А. Антонюк, В. А. Королев, С. М. Башеев, Справочник конструктора по расчету и проектированию станочных приспособлений, 1969, «Беларусь».

Институт полупроводников АН СССР, Ленинград.
Получено 30.III.1971